

ISSN 2307-2180

МЕТРОЛОГІЯ

ТА

ПРИЛАДИ

10
років



НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

2 2016

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Большаков В.
Позачергові (інформаційні) збори
Академії метрології України 3

ЗАКОНОДАВЧА МЕТРОЛОГІЯ

Малецька О., Москаленко М.
Повірка та калібрування
засобів вимірювальної техніки на підприємствах 5

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кричевець О.
Проблеми метрологічного забезпечення
вимірювань показників якості електричної енергії 10

ПОВІРКА ТА КАЛІБРУВАННЯ

Шабашкевич Б., Добровольський Ю., Юрєв В.
Метрологічний комплекс для перевірки
і градування оптоелектронних приладів,
чутливих в ультрафіолетовому діапазоні 14

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ

Приміський В., Корнієнко Д.
Стан та перспективи розвитку
вимірювачів пилу.
Частина I. Методи вимірювання 21

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ

Троцько М., Нарежний А., Трищ Р.
Приймач-компаратор для виділення
еталонних сигналів часу
із зображень цифрового телебачення 31

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Чеберячко С., Радчук Д., Чеберячко Ю.
Методика підбору випробувачів
для дослідження фільтрувальних респіраторів 36

ТОЧНІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ

Федін С., Салівон О., Зубрецька І.
Параметрична компенсація нелінійності температурної
залежності NTC-термісторів 41

ПОХИБКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Стадник Б., Хома В., Хома Ю.
Застосування штучних нейронних мереж
для коригування похибок вимірювання імпедансу 47

МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Пістун Є., Матіко Г., Крих Г.
Моделювання схем вимірювальних перетворювачів
із застосуванням теорії множин 53

ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Назаренко Л., Васильєва Ю., Ляшенко О.
Якісна оцінка світлового середовища
у приміщеннях за критерієм насиченості світлом 62

НАНОМЕТРОЛОГІЯ

Ковальчук В., Цуркан О.
Нанокластерна модифікація аморфної плівки (матриці) 68

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

План набору слухачів на 2016 рік 72

ІНФОРМАЦІЯ

4, 13, 30, 35, 40, 61, 67

TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Bolshakov V.
Extraordinary (informational) Meeting
Ukraine Academy of Metrology

LEGAL METROLOGY

Maletska O., Moskalenko M.
Testing and Calibration
Measuring Instruments for Enterprises

METROLOGICAL ASSURANCE

Krychevets A.
Problems of Metrological Support
of Measurements of Quality Indicators of Electricity

VERIFICATION AND CALIBRATION

Shabashkevych B., Dobrovolsky Yu., Yuryev V.
Metrological Complex
for Verification and Calibration
of Optoelectronic Devices, Sensitive to Ultraviolet

METHODS OF MEASUREMENT

Primisky V., Korniienko D.
Condition and Possibilities of Development
in Measurement Devices of Dust.
Part I. Methods of Measurements

MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

Trotsko M., Narezshny A., Trishch R.
The Receiver-comparator
for Etalon Time Signals Extraction
from the Digital TV Images

MEASUREMENT AND TESTS

Cheberiachko S., Radchuk D., Cheberiachko Yu.
Method of Test Subjects Choosing
for Researching of the Filtering Respirators

ACCURACY AND RELIABILITY

Fedin S., Salivon O., Zubretska I.
Parametric Compensation for Nonlinear Temperature
Dependence of NTC-Thermistors

ERRORS AND UNCERTAINTY

Stadnyk B., Khoma V., Khoma Yu.
Application Artificial Neural Networks
for Correction of Impedance Measurement Errors

MEASURING SYSTEMS MODELATION

Pistun Yeou, Matiko H., Krykh H.
Modelling the Schemes of Measuring
Transducers Using Set Theory

QUALITY AND EFFICIENCY

Nazarenko L., Vasilyeva Y., Lyashenko O.
Qualitative Evaluation of Light Indoor Environment
on Light Saturation Criterion

NANOMETROLOGY

Kovalchuk V., Tsurkan A.
Nanocluster's Modification of Amorphous Film (matrix)

TRAINING EXPERTS

State Enterprise for Year 2016

INFORMATION